



電気通信研究所

- ナノ・スピメメモリ回路用電子線描画システム (JEOL JBX-9300SA)
- 電子ビーム描画装置 (JEOL JBX-9000MV)
- イオンビーム加工解析装置 (Carl-Zeiss NVision40)
- 防音シールド室 (日本音響エンジニアリング)
- 無音室 (日本音響エンジニアリング)
- 高分解能走査型電子顕微鏡 (STEM) (日立 SU8000 Type1)
- 高分解能 X 線回折装置 (フリリップス X' Pert PRP MRD)
- 光学薄膜作製装置 (アルバック HPS-510S, EGK-3M)
- 電子ビーム蛍光 X 線元素分析装置 (EPMA) (日立 SU6600)
- X 線励起蛍光 X 線元素分析装置 (XRF) (リガク Supermini-M)
- 超精密格子定数測定用 X 線回折装置 (リガク Super Lab)




多元物質科学研究所

- 高電圧パルス選択性粉砕装置 (SELFRAG AG SELFRAG Lab Starter Kit)
- 3D 測定レーザー顕微鏡 (オリンパス LEXT OLS)
- 高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計 (Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS)
- 高温 Skimmer カップリングシステム (Netzsch QMS403/5)
- 高速ラマンイメージングシステム (Renishaw inVia)
- フロー式粒子像分析装置 (シスメックス FPIA-3000)
- モジュラーコンパクトレオメータ (アントンパール MCR302)
- 示差走査熱量計 (TA Instruments DSC Q2000)
- マクロトライボロジー試験機 (BrukerAX UMT3-HTRD)
- 薄膜表面評価用インプレーン X 線回折装置 (リガク SmartLab 90TF)
- レオメータ (Brookfield RS-CPS)
- 接触角・表面張力計 (協和界面科学 DM-301)
- 摩擦試験機 (Bruker AXS)




流体科学研究所

- 低乱流伝達風洞装置 (在原製作所製 単路回流型風洞)
- 小型低乱流洞装置 (在原製作所製 単路回流型風洞)
- 弾道飛行装置 (ノビテック)




産学連携先端材料研究開発センター

- 多種試料観察用走査電子顕微鏡システム (JEOL JSM7800F, IB-09010CP)
- 顕微可視赤外分光システム (東京インストルメンツ NX-FILM-TO3)
- 多機能走査型 X 線電子分光分析装置 (アルバックファイ PH-5000 VersaProbe II)
- 電解放出型電子プローブマイクロアナライザ (JEOL JXA8530F)
- サーマルクリーンチャンバー (日本エアテック TCC-603523A4S3)
- 微細加工システム (FEI Helios600i)
- 多目的 X 線結晶構造解析システム (リガク VaritMax DW, SmartLab 3G)
- 高分解能 EPMA 装置 (JEOL JXA-8530F)
- 高速昇温型示差走査熱量計 (DSC) (パーキンエルマー ジャパン DSC8500)
- 高速昇温型示差熱重量同時測定装置 (TG/DTA) (日立ハイテックサイエンス TG/DTA7300)
- 振動試料型磁力計 (VSM) (東栄科学産業 PV-M10-5)
- 高位相角対応型高精度 BH アナライザ (岩通計測 SY-8219)
- 高周波対応型高精度インピダンスアナライザ (Agilent Technologies 4294A)
- 高強度 X 線回折装置 (XRD) (リガク SmartLab 9MY)



先端電子顕微鏡センター

- サブオングストローム電子顕微鏡 (FEI Titan80-300)
- 低加速高分解能走査電子顕微鏡 (日立 SU8000)



生命科学研究所

- 共焦点レーザーキャン顕微鏡 (Carl-Zeiss LSM710)
- 飛行時間型質量分析装置 (AB SCIEX 5800 MALLDI TOF)
- 環境ゲノム解析システム (Roche Diagnostics JPFLX-12)
- マイクロウェーブプロセッサ (エナジービームサイエンス H2850)
- 生体低分子測定装置 組織プロテオーム解析装置 (AB SCIEX Triple TOF5600)
- 核酸分子定量解析装置 RNA 解析用アレイスキャナー 生体分子間相互作用解析装置 (Biacore T200, Agilent DNA Microarray)
- レーザーマイクロダイセクション (MDS Analytical Technologies ArcturusXT)
- 走査型近接場ラマン分光装置 (東京インストルメンツ Nano Finder)
- 和周波発生振動分光装置 (東京インストルメンツ fs-SFG DR)